

JACA No.43-2006

クリーンルームにおける基板表面汚染物質の測定方法指針

1. 適用範囲
2. 引用規格
3. 定義
 - 3.1 表面
 - 3.2 基板
 - 3.3 表面付着粒子計数器
4. 対象とする基板と汚染物質
 - 4.1 対象基板
 - 4.2 対象汚染物質
 - 4.3 測定方法の概要
5. 粒子の測定の流れと計画
 - 5.1 基板表面の準備
 - 5.2 測定手順及び方法
 - 5.3 定量方法
 - 5.4 結果の表示
 - 5.5 測定における留意点
6. 分子状物質の測定の流れと計画
 - 6.1 有機物質の測定
 - 6.2 酸性及び塩基性物質の分析
 - 6.3 金属の分析
7. ブランク低減手法
 - 7.1 測定対象基板とブランク低減対象汚染物質
 - 7.2 基板のブランク低減
 - 7.3 測定におけるブランク低減
 - 7.4 前処理・分析環境のブランク低減
8. 精度の検証方法
 - 8.1 精度検証項目
 - 8.2 精度の検証
 - 8.3 精度検証方法の参照規格
9. 結果の報告事項
 - 附属書1 対象基板表面と測定方法
 - 附属書2 表面脱離粒子の測定
 1. 概要
 2. 適用範囲
 3. 装置
 4. 準備
 5. 手順
 6. 結果の表示
 7. 注意事項
 - 附属書3 基板のコンデイショニング操作
 1. 適用範囲
 2. コンデイショニング操作
 - 2.1 初期コンデイショニング
 - 2.2 仕上げコンデイショニング
 3. コンデイショニング上の注意事項
 - 附属書4 基板表面の総汚染有機物量の算出方法
 1. 本指針で定める基板表面の総汚染有機物量の算出方法
 2. 他の規格で定められている基板表面の総汚染有機物量の算出方法
- 解説1 分析法の概略
 1. 表面分析法について
 2. 分子状汚染の表面分析方法
- 解説2 質量濃度と原子・分子数濃度の関係
- 解説3 関連規格のリスト